

06.3

© 1990

ДЛИННОВОЛНОВЫЕ СВЕТОДИОДЫ НА ОСНОВЕ $GaInAsSb$
ВБЛИЗИ ОБЛАСТИ НЕСМЕШИВАЕМОСТИ
($\lambda = 2.4\text{--}2.6$ мкм, $T = 300$ К)

А.Н. Именков, О.П. Капранчик,
А.М. Литвак, А.А. Попов,
Н.А. Чарыков, Ю.П. Яковлев

1. Спектральный диапазон длин волн 1.8–2.6 мкм перспективен для волоконно-оптических линий связи третьего поколения, а также для задач влагометрии и газового анализа. Среди соединений A^3B^5 наибольший интерес для создания источников света в этом спектральном диапазоне представляют твердые растворы $GaInAsSb$, изопериодные к подложке $GaSb$.

В работах [1–3] нами сообщалось о создании и исследовании высокоеффективных светодиодов на основе гетероструктур $GaInAsSb/GaAlSbAs$ для спектрального диапазона 1.8–2.4 мкм с внешним квантовым выходом 1–4 %. Особый интерес представляет создание светодиодов в области минимума дисперсионных потерь флюоритных волокон в диапазоне 2.5–2.6 мкм [4]. Однако создание таких излучателей в этом спектральном диапазоне вызывает большие трудности из-за наличия обширной области несмешиваемости в системе твердых растворов $GaInAsSb$ для составов в области $0.24 \leq X \leq 0.76$ [5].

В результате теоретического и экспериментального анализа области несмешиваемости нами впервые была показана возможность получения твердых растворов $GaInAsSb$ с содержанием индия вплоть до $X = 0.29$ [6] исходя из ограничений по условиям спин-онидального распада и условиям молекулярности, и синтезированы такие слои.

Данная работа является продолжением начатых нами исследований [1–3, 6] и посвящена созданию и изучению светодиодов на основе $GaInAsSb$ вблизи области несмешиваемости с максимумом излучения около 2.5 мкм.

2. Светодиоды представляли собой структуру (рис. 1, а), состоящую из активного слоя $n\text{-}Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$ ($X = 0.27$), выращенного на подложке $n\text{-}GaSb:Te$ ($6\text{--}9 \cdot 10^{17}$ см $^{-3}$) и широкозонного эмиттера $p\text{-}Ga_{1-x}Al_xAs_ySb_{1-y}$ ($X = 34$ %).

Для получения активного слоя $GaInAsSb$ вблизи границы несмешиваемости с максимальным содержанием индия были реализованы условия эпитаксиальной кристаллизации, изложенные в работе [6]. Это позволило получить слои $GaInAsSb$ с $X = 0.27$ (рис. 1, в), что существенно превысило содержание индия в слоях ($X = 0.22\text{--}0.24$), полученное нами ранее в работах [2, 3].

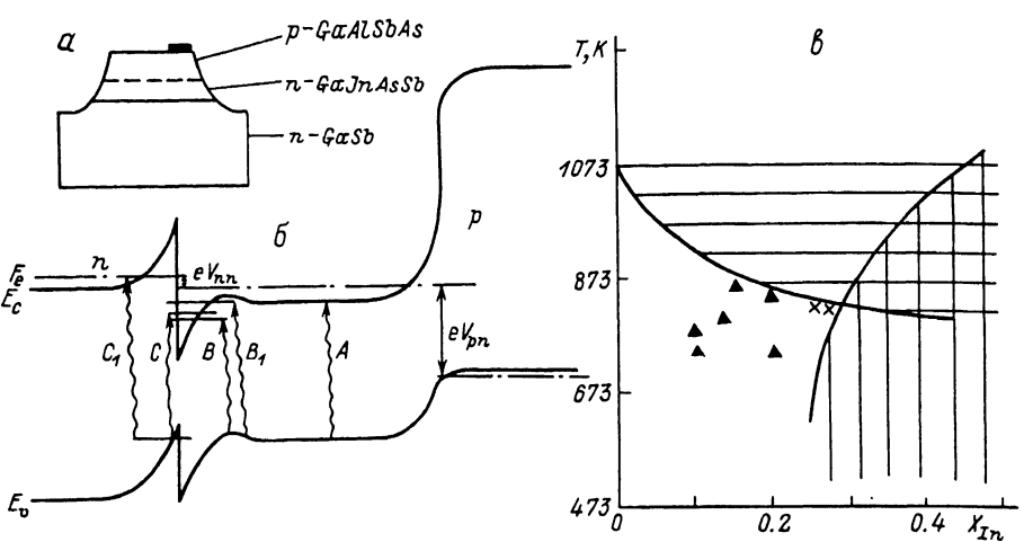


Рис. 1. Структура светодиода и его основные параметры: а - структура мезасветодиода, б - энергетическая диаграмма $n\text{-GaSb}$ - $n\text{-GaInAsSb}$ - $p\text{-GaAlAsSb}$ структуры при приложении прямого смещения, в - зависимость содержания In (x) в твердом растворе от температуры эпитаксии.

Φ , отн.ед.

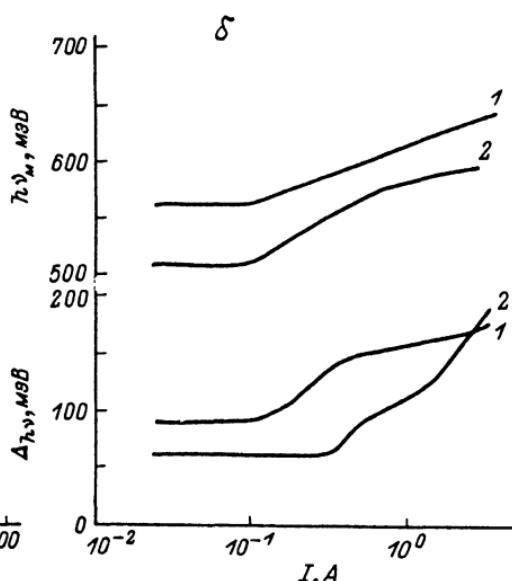
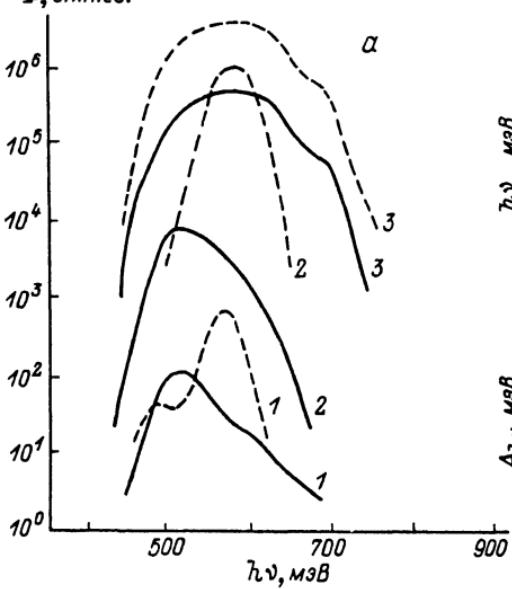


Рис. 2. Электролюминесцентные свойства светодиодов с „толстой” активной областью: а - спектры излучения при различных токах (1 - 0.02 А, 2 - 0.15 А, 3 - 4 А) при 300 К (сплошные линии) и 77 К (пунктир), б - зависимости энергии максимума $\Delta h\nu_m$ и полуширины полосы излучения $\Delta\Delta h\nu_m$ при 77 К (1) и 300 К (2) от тока.

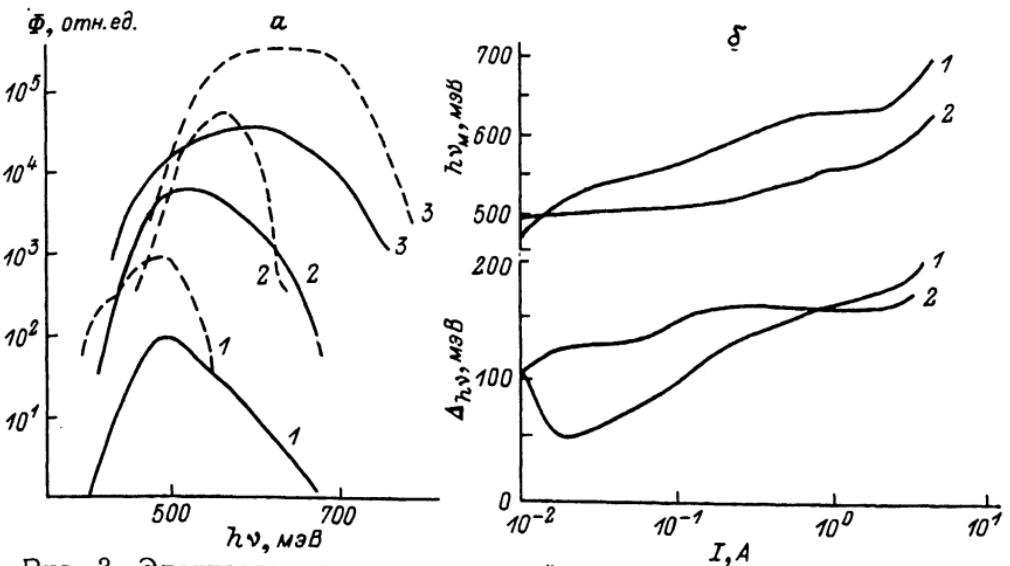


Рис. 3. Электролюминесцентные свойства светодиодов с „тонкой“ активной областью. а – спектры излучения при различных токах (1 – 0.02 А, 2 – 0.15 А, 3 – 4 А) при 300 К (сплошные линии) и 77 К (пунктир), б – зависимости энергии максимума $\hbar\nu_m$ и полуширины полосы излучения $\Delta\hbar\nu_m$ при 77 К (1) и 300 К (2) от тока.

Активный слой структуры был легирован теплуром до концентрации носителей $\sim 1 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, а широкозонный эмиттер – германием до концентрации дырок $\sim 2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$.

Исследовались структуры двух типов: с „толстой“ (толщина слоя $h = 1.2\text{--}1.5 \text{ мкм}$) и с „тонкой“ ($h = 0.3 \text{ мкм}$) активной областью. Структуры с „толстой“ активной областью получались путем последовательного наращивания четырех тонких слоев GaInAsSb друг на друга.

Из полученной гетероструктуры были изготовлены мезасветодиоды (рис. 1, а) диаметром 300 мкм со сплошным омическим контактом к $n\text{-}\text{GaSb}$ ($\text{Au} + 5\% \text{ Te}$) и точечным контактом диаметром 40 мкм ($\text{Au} + 5\% \text{ Ce}$) к $p\text{-}\text{GaAlAsSb:Ge}$.

Исследовались электролюминесцентные и вольтамперные характеристики светодиодов. Измерения проводились с помощью монохроматора МДР-12, а в качестве приемника использовалось охлаждаемое до $T = 77 \text{ К}$ fotosопротивление из InSb . Приведенные на рис. 2 и 3 электролюминесцентные характеристики получены как при постоянном (в интервале токов 10–150 мА), так и импульсном (в интервале токов 150–6000 мА, длительность импульса 150 нс, скважность 66) режиме питания.

3. Рассмотрим электролюминесцентные характеристики светодиодов. Вначале рассмотрим характеристики „толстых“ образцов (рис. 2), в которых толщина активной области GaInAsSb составляла 1.3 мкм.

Для этих структур характерно, что энергия максимума полосы излучения составляет 500–510 мэВ (300 К) и 560–570 кэВ (77 К).

и практически не зависит от тока в интервале 0.02–0.2 А (как для $T = 77$ К, так и для 300 К), а затем начинает монотонно возрастать при изменении тока в интервале 0.2–6 А. При этом следует отметить, что разница между $h\nu_m$ при $T = 77$ К и $T = 300$ К составляет 55 мэВ, что меньше разницы $h\nu_m$ фотоплюминесценции для $T = 77$ К и $T = 300$ К, полученных на толстых слоях этого же твердого раствора. Полуширина полосы излучения составляет при малых токах 60 мэВ (77 К) и 80 мэВ (300 К) и также увеличивается с ростом тока при $I > 150$ мА.

Рассмотрим теперь электролюминесцентные характеристики структур с „тонкой“ активной областью, толщина которой составляет 0,3 мкм.

Форма спектров таких структур видоизменяется с ростом тока, зависимость $h\nu_m$ и полуширины полосы излучения от тока имеет сложный характер, содержит чередующиеся участки роста и стабилизации в зависимости от тока.

Уникальной особенностью спектров люминесценции „тонких“ структур является то, что при малых токах ($I = 0.01$ мА) энергия максимума полосы излучения при $T = 300$ К больше, чем энергия максимума при $T = 77$ К, и с ростом тока в интервале 0.01–0.1 А ($T = 300$ К) $h\nu_m$ практически не зависит от тока, а при $T = 77$ К $h\nu_m$ резко возрастает (рис. 3, а, б). Отличительной особенностью спектров люминесценции является также и то, что полуширина полосы излучения при $T = 77$ К уменьшается почти в два раза от 110 мэВ до 50 мэВ с ростом тока от 0.1 до 0.03 А, а затем снова возрастает. При $T = 300$ К характерно возрастание полуширины полосы излучения на начальном участке роста тока, насыщение при токах в интервале 0.1–1 А, и дальнейшее возрастание при $I > 1$ А. Следует отметить, что в спектрах излучения как „толстых“, так и „тонких“ образцов при низких температурах ($T = 77$ К) и малых токах (0.01–0.03 А) обнаруживается вторая длинноволновая полоса излучения.

Квантовый выход излучения γ увеличивается в 2–3 раза с ростом тока в интервале 20–200 мА и достигает 0.5–1% ($T = 300$ К), а при $T = 77$ К γ составляет около 20%.

Вольтамперная характеристика светодиодов имеет два экспоненциальных участка для обоих типов структур. При токе 10–30 мА проявляется первый участок, где $I \sim \exp\left(\frac{qU}{\beta kT}\right)$, $\beta = 1-1.5$, а при токе > 30 мА – второй участок, где $I \sim \exp\left(\frac{qU}{\varepsilon}\right)$, где $\varepsilon = 50-100$ мэВ. Последовательное сопротивление структур составляло 1–2 Ом.

4. Проанализируем полученные экспериментальные результаты. Узкозонный слой $GaInAsSb$ образует с n - $GaSb$ гетеропереход II – типа [7], в котором зонная энергетическая диаграмма узкозонного полупроводника смешена относительно энергетической диаграммы $GaSb$, так что разрыв в зоне проводимости и валентной зоне имеет один и тот же знак. В такой структуре при инжекции дырок в n - $InGaSbAs$ область возможно несколько

типов излучательных переходов (рис. 1, б): квазимежзонная рекомбинация А в толще слоя и несколько типов интерфейсной рекомбинации В, В₁, С и С₁ на п-п-гетерогранице. Излучательные переходы типа А, В были недавно идентифицированы как на р-*GaSb*-р-*GaInAsSb* [8], так и на п-*GaSb*-п-*GaInAsSb* гетерогранице [3], где содержание индия составляло 0.2–0.24.

В данной работе (содержание индия в твердом растворе составляло 0.27), по-видимому, проявляются интерфейсные переходы типа В₁ (рекомбинация дырок на второе локализованное состояние электронов) и С и С₁ (рекомбинация связанных дырок в *GaSb* с локализованными в свободными электронами в подложке).

Проанализируем вначале характер излучения из структур с „толстой” активной областью. При Т = 300 К в таких структурах преобладает квазимежзонная рекомбинация (переход типа А), так как при малых токах $h\nu_m$ у них больше, чем у „тонких”, а при больших токах $h\nu_m$ увеличивается с ростом тока быстрее, чем при Т = 77 К и быстрее, чем в структурах с „тонкой” активной областью.

Однако при Т = 77 К в „толстых” структурах наряду с межзонной рекомбинацией существенную роль играет и интерфейсная рекомбинация (переходы типа В и С). На это указывает наличие длинноволновой полосы излучения при малых токах (рис. 2, а), энергия максимума которой увеличивается с ростом тока и сливается с основной полосой излучения.

В структурах с „тонкой” активной областью интерфейсная рекомбинация, вероятно, является доминирующей как при 300 К, так и при 77 К. При малых токах (Т = 77 К), вероятно, проявляются две интерфейсные полосы (переходы типа В и С), что приводит к большой полуширине полосы излучения в этих условиях. Согласно [7], для твердого раствора такого состава ($X=0.27$) разрыв в валентной зоне на гетерогранице с *GaSb* составит $\Delta E_V \approx 0.18$ эВ, а разрыв в зоне проводимости $\Delta E_c \approx 0.4$ эВ (для $E_g \approx 0.5$ эВ). При таких условиях, когда величина ΔE_V соизмерима с величиной $\Delta E_c/2$, становится возможным проявление интерфейсной рекомбинации двух типов.

При возрастании тока через структуру увеличивается падение напряжения и на п-п-переходе, при этом глубина квантовой ямы для электронов уменьшается, а уровень для дырок в *GaSb* становится выше потолка валентной зоны узкозонного слоя, что приводит к преобладанию в излучении полосы С. В результате происходит сужение полуширины полосы излучения с ростом тока.

При дальнейшем возрастании тока ($I > 1$ А) ширина п-п-перехода уменьшается настолько, что становятся возможными переходы типа В₁ и С₁ с более высокими энергиями фотона, чем переходы типа В и С. Такой вывод подтверждается возрастанием энергии максимума полосы излучения с ростом тока.

Преобладание интерфейсной рекомбинации в „тонких” структурах по сравнению с „толстыми” объясняется как более резкой п-п-гетерограницей в „тонких” структурах, так и меньшим влиянием квази-

межзонной рекомбинации в толще активной области.

Итак, в результате использования твердого раствора $GaInAsSb$ с рекордно высоким содержанием индия ($X = 0.27$) удалось получить светодиоды с длиной волны излучения 2.4–2.6 мкм с внешним квантовым выходом $\sim 1\%$.

Список литературы

- [1] Андаспаева А., Баранов А.Н., Гусейнов А., Именков А.Н., Литвак А.М., Филаретова Г.М., Яковлев Ю.П. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 9. С. 845–849.
- [2] Андаспаева А., Баранов А.Н., Гусейнов А.А., Именков А.Н., Колчанова Н.М., Сидоренкова Е.А., Яковлев Ю.П. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 18. С. 71–75.
- [3] Андаспаева А.А., Баранов А.Н., Гребенщикова Е.А., Гусейнов А.А., Именков А.Н., Рогачев А.А., Филаретова Г.М., Яковлев Ю.П. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 8. С. 1373–1377.
- [4] Дианов Е.М. // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 1983. Т. 26. № 5. С. 27–35.
- [5] De Winter J.C., Pollack M.A., Srivastava A.R., Ziskind J.C. // J. of Elect. Mater. 1985. V. 4. N 6. P. 729–747.
- [6] Баранов А.Н., Гусейнов А.А., Литвак А.М., Попов А.А., Чарыков Н.А., Шерстнёв В.В., Яковлев Ю.П. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. В. 5. С. 33–38.
- [7] Nakao M., Yoshido S. and S. Gonda // Sol. St. Comm. 1984. V. 49. N 7. P. 663–666.
- [8] Баранов А.Н., Гусейнов А.А., Рогачев А.А., Титков А.Н., Чебан В.Н., Яковлев Ю.П. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 6. С. 342–344.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
АН СССР,
Ленинград

Поступило в Редакцию
5 октября 1990 г.